Universidade de São Paulo Instituto de Física

FAP5844 - Técnicas de Raios-X e de feixe iônico aplicados à análise de materiais

> Manfredo H. Tabacniks FI1-2008

12/08	FI-1	Revisão: Interação de fótons (raios-X) com a matéria para anális elementar: Absorção e emissão de raios-X característicos. Interação de íons energéticos com a matéria: Poder de freament excitação detrónica, espalhamento elástico.
19/08	FI-2	Raios-X para análise elementar: Fundamentos dos métodos XRF PIXE. Análise qualitativa e quantitativa elementar.
26/08	FI-3	Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação e espectros de raios X. Exemplos e exercícios.
04/09		Laboratório PIXE no LAMFI
05/09		
65/09 Setembro 02/09	2008 FI-4	Fundamentos da Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford RBS. Análise e interpretação de espectros RBS
62/09 62/09 16/09	2008 FI-4 FI-5	Fundamentos da Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford RBS. Análise e interpretação de espectros RBS Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação d expectros RBS. Exemplos e exercícios.
5etembro 02/09 16/09 18/09 19/09	2008 FI-4 FI-5	Fundamentos da Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford RBS. Análise e interpretação de espectros RBS Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação d espectros RBS. Exemplos e exercícios. Laboratório RBS no LAMFI
05/09 6etembro 02/09 16/09 18/09 19/09 23/09	2008 FI-4 FI-5 FI-6	Fundamentos da Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford RISS. Análise e interpretação de espectros RBS Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação de espectros RBS. Exemplos e exercícios. Laboratório RBS no LAMFI Aplicações avançadas: Difusão em filmes finos, rugosidade, filme multicamada e multidementares; análise PIXE de amostras espessas Análises PIXE em feixe externo.
05/09 6etembro 02/09 16/09 18/09 19/09 23/09 30/09	2008 FI-4 FI-5 FI-6 FI-7	Fundamentos da Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford RBS. Análise e interpretação de espectros RBS Instrumentação, bases de dado e soft vares para análise e simulação d espectros RBS, Exemplos e exercícios. Laboratório RBS no LAMFI Aplicações avançadas: Dífusão em filmes finos, rugosidade, filme multicamada e multidementares; análise PIXE de amostras espessa Análises PIXE em feixe externo. Apresentação e discussão dos resultados das análises PIXE e RBS.





No século 18, a chama dos materiais indicava a presença de elementos específicos. O maçarico (bico) de Bunsen (1811-1899) aperfeiçoou a espectroscopia de chama. Uma chama de cor fraca e muito quente, simples e fácil de usar.













A















































métodos analíticos

Rutherford Backscattering RBS Spectrometry ERDA Elastic Recoil Detection Analysis

- alta sensibilidade: < 10^{14} Au/cm² absoluto: não necessita calibração perfil em profundidade ($\Delta x 100$ Å) rápido: 10-20 min sensível à topografia (tese Dr.)

PIXE Particle Induced X ray Emission PIGE Particle Induced Gamma ray Emission

- alta sensibilidade: ppm (ou 10¹⁴ at/cm²)
 Z > 11
 necessita calibração
 rápido : 10-20 min

Feixe externo para amostras especiais

medir todos os elementos da tabela periódoca

- SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry

- feixe ¹⁶O, 20 keV, 3μm
 altissima sensibilidade: 10¹² at/cm²
 todos elementos da tabela periódica
 mapa elementar
 imagem por elétrons retroespalhados
 semiquantitativo
 perfil em profundidade (Δx ~ 10 Å)

AMS Accelerator Mass Spectrometry

hiper alta sensibilidade: 1: 10¹⁴
composição isotópica
absoluto: não necessita calibração

AMS-2 Accelerator Mass Spectrometry Instalação de um espectrômetro de m no implantador de ions de 300kV. Sensibilidade prevista 10¹⁰ at/cm². (em projeto de viabilidade)

www.if.usp.br/manfredo/fap5844

www.if.usp.br/lamfi/tutoriais.htm Tutorial 1. Análise de filmes finos por PIXE e RBS